

(回答)

アモルファス材料においては、回折図形のハローリングの強度分布から、干渉関数、2体分布関数を計算し構造評価を行う研究がなされています。ただそのためには、0スポットに近い低角側の強度を定量評価する必要があるため、ワイドレンジに高いリニアリティを持つ記録媒体が必要です。

もちろん、非晶質材料（アモルファス）では長期的な規則性は無いので、“電子回折”モードで撮影しても映る“電子回折図形”は回折による描像ではなく、散乱による描像です。

(市川 聡)